

2010年海峡两岸材料破坏/断裂学术会议 —"材料试验技术"技术座谈会 2010年9月24~25日 垦丁

## 纳米压入识别脆性材料 断裂韧度的新方法

# 冯义辉 张泰华 郇 勇(中国科学院力学研究所 非线性力学国家重点实验室)





容 内





紧凑拉伸(CT)、三点弯(SENB)、双悬臂梁(DCB)...





紧凑拉伸 (CT)试验

▶试样尺寸为厘米量级或更大











容 内















▶特征尺寸:径向裂纹长度C





条件:裂纹径向扩展良好(C/a>2)



▶结论1:卸载加剧径向裂纹的扩展;

▶结论2:残余应力场简化为一对集中力F<sub>r</sub>:

$$F_r \propto F_m \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \left(\cot \alpha\right)^{3/2}$$

[1] Lawn B.R., Evans A.G., Marshall D.B., J. Am. Ceram. Soc., 1980, 63: 574~581









## 基于LEM模型的K<sub>IC</sub>测试方法

方法	公式	压头	优、缺点
Lawn-Anstis法 <sup>[1,2]</sup>	$K_{IC} = 0.016 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \frac{F_m}{c^{3/2}}$	Vickers	对材料微观结构不敏感 临界载荷高、需另测E
Laugier法 <sup>[3]</sup>	$K_{IC} = 0.015 \left(\frac{a}{l}\right)^{1/2} \left(\frac{E}{H}\right)^{2/3} \frac{F_m}{c^{3/2}}$	Vickers	对材料微观结构不敏感 临界载荷高、需另测E 测量量多
Harding-Oliver- Pharr法 <sup>[4]</sup>	$K_{IC} = 0.036 \left(\frac{E}{H}\right)^{1/2} \frac{F_m}{c^{3/2}}$	cube-corner + Berkovich	临界试验载荷低 需更换压头测E, H

▶缺点: 1) 另测E、H, 程序复杂; 2) 影响因素多(pile-up、模型近似性)

[2] G.R. Anstis, P Chantikul, B.R. Lawn and D.B. Marshall, J. Am. Ceram. Soc., 1981, 64: 533~538
[3] M.T. Laugier, J. Mater. Sci. Lett., 1987, 6: 355~356

[4] D.S. Harding, W.C. Oliver and G.M. Pharr, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 1995, 356: 663~668





cube-corner压头的优势一:载荷低<sup>[4]</sup>

材料	cube-corner 临界载荷(mN)	Vickers 临界载荷(mN)
Soda-lime glass	0.5~1.5	250~500
Fused quartz	0.5~1.5	1000~1500
Pyrex glass	1.5~4.4	500~1000
Silicon(100)	0.5~1.5	20~50
Silicon(111)	0.5~1.5	50~100
Germanium(111)	1.5~1.5	<10
Sapphire(111)	4.4~13.3	50~100
Spinel(100)	4.4~13.3	100~150
Silicon nitride(NC132)	40~120	1000
Silicon carbide(SA)	4.4~13.3	100~150

▶临界载荷: cube-corner 比 Vickers/Berkovich 低1~2个数量级





#### Vickers, 40N

#### cube-corner, 0.5N



#### fused silica

▶开裂方式: cube-corner压头使材料更易在径向开裂





容 内





## 特点

- cube-corner压头,显著降低临界载荷,适于微区测试。
  单次加卸载,避免更换Berkovich压头,简化测试程序。
- ●选W<sub>u</sub>/W<sub>t</sub>作为分析参量,易于精确测量,降低测试误差。







[5] Taihua Zhang, Yihui Feng, Rong Yang, and Peng Jiang. Scripta Mater., 2010, 62(4): 199~201













▶发表在: Scripta Materialia, 62(4): 199-201 Feb 2010.





容 内











▶光滑的F-h曲线对应有效的W<sub>u</sub>/W<sub>t</sub>





### 有效性判据

1) 径向裂纹扩展良好(c/a>2)
 2) 样品表面无明显材料剥落
 3) 试验曲线基本光滑



谢谢您!

请指正